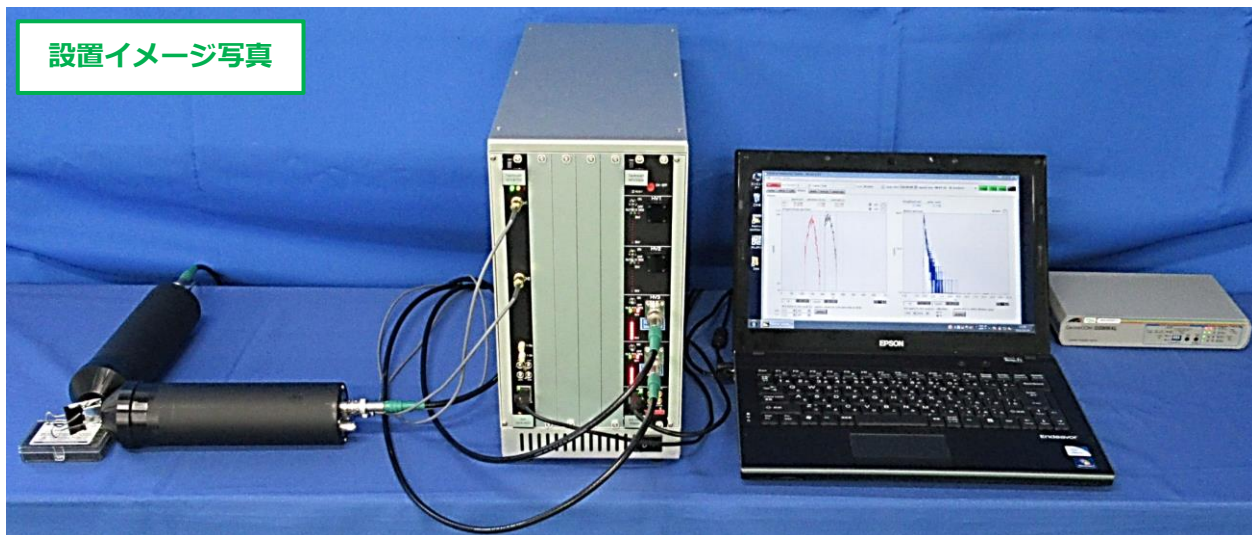


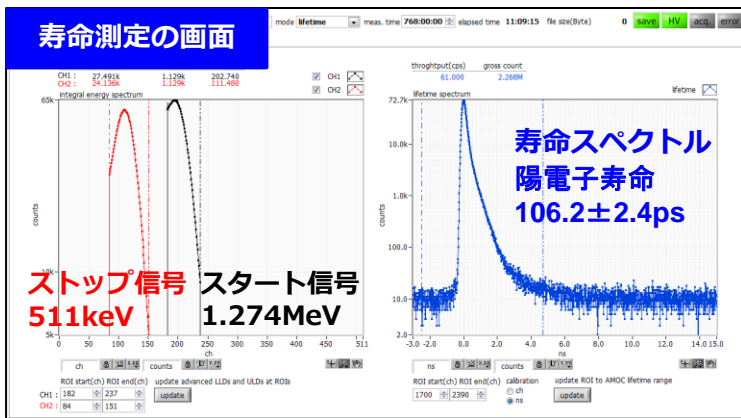
分子レベルのナノスケール空間構造を解析できる陽電子消滅法の測定に必要な計測・電源機器がひとつになりました。寿命測定では2台のBaF₂シンチレータからの高速パルス信号を3GSPSのボードで取り込み寿命時間を算出します。

設置イメージ写真

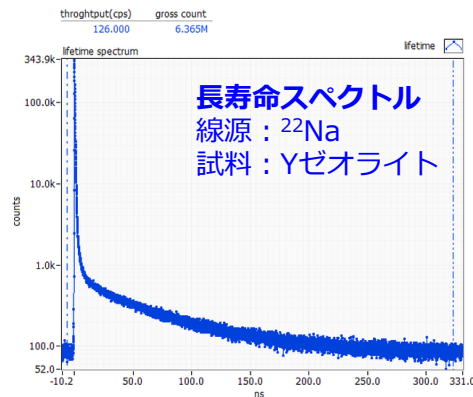


| | |
|-------|--|
| 検出器 | BaF ₂ 検出器×2台 |
| ADC | 2CH 3GspS 8-bit (寿命測定用) |
| 時間分解能 | FWHM <180ps |
| 測定レンジ | <80ns (最小Time/ch 10.2ps時)、<1100ns (最大Time/ch 166ps時) |
| 寿命測定 | 標準物質ステンレス鋼 106.2±2.4 ps 陽電子寿命 標準物質石英ガラス 1.62±0.05 ns オルトポジトロニウム寿命 |
| 高圧電源 | 2CH、最大-4000V(最大1mA) / CH (光電子増倍管用) |
| 通信 | イーサネット (TCP/IP) |
| 付属品 | ノートPC、データ収集制御用アプリケーション、信号ケーブル2本、高圧電源ケーブル2本、スイッチングハブ、LANケーブル3本 |
| 別途必要品 | ²² Na線源、寿命解析用アプリケーション |
| 外径寸法 | 高さ320×幅170×奥行400 (mm) |
| 重量 | 約7400g |

寿命測定画面



線源：²²Na 試料：標準物質ステンレス鋼



※写真はイメージです。
※記載内容は予告なく変更することがあります。

